



SpecMetrix® DFTQA

实验室干膜厚度质量保证系统

干膜厚度质量保证系统

SpecMetrix® DFTQA系统为干膜厚度提供了一个全新的非接触、非破坏性和实时绝对测量数据标准。无论是底漆、面漆、透明或着色样品，我们的DFTQA系统都能让您获得详细的涂层测量数据和分析。

SpecMetrix® DFTQA系统专为简化干膜厚度的质量控制流程而设计，它是在卷材涂层实验室测量中首选的工具之一，具有亚微米级精度。它利用我们独有的技术来改进涂层工艺和质量控制，同时减少质量控制实验室或研发中心的成本。



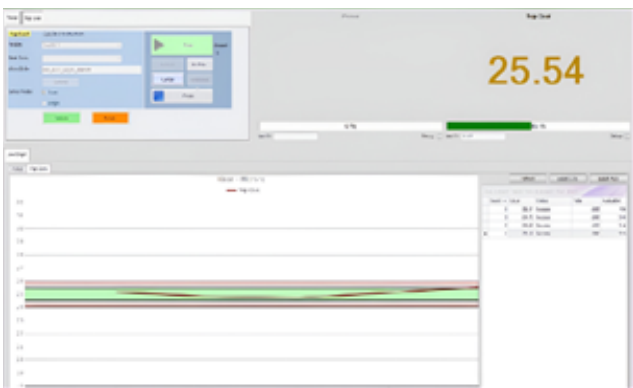
▲ 易于使用的 SpecMetrix 系统软件，可更快地获得 DFT 干膜厚度测量结果。

设备特点与优势：

- **非接触且非破坏性**
测量过程中不会损坏涂层或基材，保持样品的完整性。
- **绝对厚度测量**
提供样品区域内精确的涂覆层厚度和干膜厚度（DFT）测量。无需针对不同颜色或基材进行重新校准。
- **基材独立**
可测量金属基材上的涂层，包括铝、钢、镀锡、冷轧镀铝锌钢板，甚至任何油漆颜色上的涂层。
- **广泛应用**
实时测量已应用的底漆、底涂层、面漆、清漆、背涂层、层压膜、透明涂层及其他卷材涂层。
- **卓越的测量仪 R&R**
测量精度不受操作员技能或人为误差的影响，确保系统的可重复性和再现性。
- **环保**
非破坏性测试方法有助于减少废料、返工劳动力和能源成本。
- **双重功能**
单个系统配置包括双重光学组件，使底漆和面漆测量速度更快。
- **强大的SensorMetric软件**
用户友好的软件包将所有数据存储到Excel®中，或与工厂网络接口以便进行SPC分析。



▲ 易于使用的 SpecMetrix 系统软件可更快地获得 DFT 干膜厚度测量结果，并提供为底漆和面漆设计专用的双探头。



▲ 能够轻松测量广泛的卷材涂层，包括聚酯、环氧树脂、纹理、金属化和PVDF

技术规格:

测量范围	0.7至350微米 (透明/清漆涂层)
	0.7至75微米* (着色/不透明涂层)
	*取决于所选的光学组件
精度	涂层厚度的±1% (标称值)
测量速度	每秒最多100次
温度范围	0° 至50° C
输出指标	微米、密耳、g/m ²
操作系统	Windows® 平台
制造	美国制造
认证	CE (S) UL

免责声明

本档中包含的信息可能会根据经验和我们持续产品开发的政策不时修改。

电话: 13901312374
邮箱: 13901312374@139com

